第一图书网, tushu007.com

<<统计过程控制>>

图书基本信息

书名：<<统计过程控制>>

13位ISBN编号：9787506655545

10位ISBN编号：7506655543

出版时间：2009-12

出版时间：中国标准出版社

作者：袁学成，胡湘洪　编著

页数：198

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书适用于ISO 9000审核员，ISO／TS 16949审核员，整车企业或汽车零部件企业专业技术人员以及军工质量管理人员，有利于相关专业技术人员掌握。
本书还可供专业技术人员作培训教材使用。
本书旨在介绍SPC设计的基本观点和方法，着重对建立SPC体系所涉及的基础知识进行必要的阐述，同时解释了在实施SPC时需了解和掌握的其他统计技术以及SPC与其他统计技术之间的内在联系。
本书的主要内容包括：统计过程控制原理及应用流程[过程概念；过程变差；局部措施和对系统采取措施；控制特性、子组和监控频率的确定；过程(控制)分类；SPC的三个目标；从工程分析、在线控制到持续改进的基本程序]。
测量系统分析，常见的计量型数据控制图(也包括特别情况下的统计过程控制应用，作业指导书和控制图的转换)，常见的计数型数据的控制图，抽样与分组的影响，目标和离散的影响，用于多品种小批量生产过程控制的控制图(归一化处理)，在ISO／TS 16949和军工质量管理体系中实施SPC的常见错误分析，以及如何建立SPC体系。

<<统计过程控制>>

书籍目录

第1章 统计过程控制原理及应用流程 1.1 概述 1.2 过程概念 1.3 过程变差 1.4 局部措施和系统性措施 1.5 统计过程控制 1.6 控制特性、子组和监控频率的确定 1.7 过程(控制)分类 1.8 统计过程控制(SPC)的三个目标 1.9 从工程分析、在线控制到持续改进的基本程序第2章 测量系统分析简单介绍 2.1 测量系统分析相关术语和概念 2.2 测量系统评定注意事项 2.3 测量系统分析流程 2.4 结果分析 2.5 计量型测量系统分析方法第3章 常见的计量型数据控制图 3.1 均值和极差控制图(X拔-R图) 3.2 均值和标准差控制图(X拔-S图) 3.3 单值和移动极差控制图(X-MR图) 3.4 特别情况下的统计技术 3.5 作业指导书的要求和控制图的转换第4章 常见的计数型数据控制图 4.1 概述 4.2 不合格品率的P图 4.3 不合格品数的np图 4.4 不合格品数的c图 4.5 单位产品不合格数的μ图第5章 实施sPC的常见错误分析 5.1 测量误差较大的情形 5.2 分辨率的影响 5.3 过程或取样分层 5.4 总体单值截尾的情况 5.5 其他例子第6章 案例分析 6.1 抽样和分组 6.2 目标和离散的影响 6.3 归一化处理 6.4 利用控制图进行持续改进第7章 电子元器件统计过程控制体系 7.1 概述 7.2 电子元器件统计过程控制体系的一般要求 7.3 预防性维护与预测性维护 7.4 SPC体系内审 7.5 SPC体系实施计划编制指南 7.6 实施SPC的流程附录一 控制图的计算公式和系数附录二 标准正态函数表参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com